

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 13/10/2021 | Edição: 193 | Seção: 3 | Página: 46

Órgão: Ministério da Economia/Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

EDITAL Nº 14 - SELEÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM METROLOGIA E QUALIDADE

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL - INMETRO - 2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - Inmetro, vinculado ao Ministério da Economia (ME), Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, nomeado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, substituto, em Portaria de 17 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 17 de fevereiro de 2020, torna público o presente edital, que divulga as condições de inscrição e de acesso ao Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade, no ano de 2022.

1. DO OBJETIVO DO CURSO

1.1 O curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade objetiva a capacitação de recursos humanos, dotando-os de conhecimentos e competências tecnológicas, mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam às demandas do mercado de trabalho em Metrologia, Qualidade, Regulação e Avaliação da Conformidade.

2. DO PÚBLICO ALVO

2.1 Portadores de diploma de graduação em qualquer área de conhecimento de qualquer nacionalidade.

3. DAS VAGAS

3.1 Serão oferecidas até 25 (vinte e cinco) vagas para ingresso no primeiro trimestre de 2022.

3.2 Os candidatos serão submetidos a processo seletivo único.

3.3 As vagas para o Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade serão preenchidas por ordem de classificação dos aprovados no processo seletivo.

3.4 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecidas.

4. DAS ÁREAS DO CURSO

4.1 As linhas de pesquisa e lista de sugestão de temas de estudo e pesquisa podem ser consultadas no sítio do Inmetro: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/pos-metrologia-e-qualidade/pos-metrologia-e-qualidade-index>.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 O prazo para inscrição será de 13 de outubro a 17 de novembro de 2021.

5.2 Todas as informações referentes às inscrições e resultados poderão ser obtidas no sítio do Inmetro: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/pos-metrologia-e-qualidade/pos-metrologia-e-qualidade-index>

5.3 A documentação descrita em 6 para a realização da inscrição deve ser encaminhada da seguinte forma:

a) Pelo candidato, através do Balcão Digital (Portal de Serviços), no endereço <https://www.gov.br/pt-br/servicos/candidatar-se-ao-processo-seletivo-para-a-pos-graduacao-em-metrologia-e-qualidade-mestrado-profissional>

5.4 A ausência de qualquer dos documentos solicitados, o envio em outro formato ou documentos não nomeados corretamente acarretará na exclusão do candidato do processo.

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

6.1 Para que a inscrição no processo seletivo seja confirmada e aceita, é necessário o envio dentro do prazo de inscrição descrito no item 5, dos seguintes documentos (ANEXO I):

a) Formulário de Inscrição no Processo Seletivo, disponível no sítio do Inmetro, devidamente preenchido;

b) Currículo Lattes cadastrado na Plataforma Lattes (<http://lattes.cnpq.br/>). O currículo Lattes deverá ser gerado em uma via, na versão resumida, selecionando todos os itens, padrão de referência ABNT, sem indexador, com todo o período de atuação profissional e de produção acadêmica;

c) Carta de Apresentação assinada pelo candidato justificando seu interesse pelo curso, mencionando o objeto de estudo, temas de interesse e a interação com suas atividades profissionais. A Carta deverá indicar a disponibilidade de tempo para realização do curso e se há interesse do candidato por bolsa de estudo;

d) Duas Cartas de Recomendação, de redação livre, redigidas e assinadas por professores ou profissionais da área de interesse do candidato, preferencialmente Mestres ou Doutores, com identificação do correio eletrônico para confirmação de seus conteúdos, quando necessário;

e) Proposta de tema de pesquisa elaborada de acordo com o formulário do ANEXO II (opcional). O Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade disponibilizará aos candidatos a lista de temas de pesquisa e respectivos docentes responsáveis no sítio do Inmetro (<https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/pos-metrologia-e-qualidade/pos-metrologia-e-qualidade-index>);

f) Formulário de Termo de Compromisso do Empregador, disponível no sítio do Inmetro, formalizando a liberação do candidato para realizar o curso, caso o candidato possua vínculo empregatício;

g) Carta do professor credenciado, disponível no sítio do Inmetro, atestando que está ciente de sua indicação como provável orientador. A aprovação do nome do orientador está vinculada à aprovação do candidato no Processo Seletivo e da disponibilidade de vagas do professor orientador para novos alunos.

h) Cópia legível do Histórico Escolar do curso de Graduação;

6.2 Os candidatos aprovados e classificados para cursar o Mestrado deverão apresentar o Diploma de Graduação (frente e verso) ou declaração de conclusão de curso superior, em papel timbrado, devidamente carimbado e assinado pelo dirigente da instituição emissora, no ato da matrícula.

6.3 A não apresentação da documentação completa no ato da inscrição, exceto aquela documentação mencionada opcional, implicará na desclassificação definitiva do candidato.

7. DA SELEÇÃO

7.1 O processo seletivo será conduzido pela Comissão Permanente de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade e constará de 4 (quatro) etapas, a saber:

7.2 As etapas de seleção serão realizadas nas datas e horários que constam do Anexo III deste edital e serão divulgadas no sítio do Inmetro na página web do PPGMQ (<https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/pos-metrologia-e-qualidade/pos-metrologia-e-qualidade-index>). Todas as etapas poderão ser realizadas remotamente se, na data em que estiverem agendadas, o País se encontrar com medidas restritivas destinadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

7.3 Primeira Etapa: Análise da Documentação

7.3.1 Serão considerados aptos, nesta Primeira Etapa, aqueles candidatos que enviarem toda a documentação elencada no item 6 (exceto a Proposta de tema de pesquisa que é considerada opcional) até o fim do prazo de inscrição. A ausência de qualquer documento exigido implicará na eliminação do candidato.

7.3.2 Os candidatos considerados aptos nesta etapa terão seus nomes publicados no sítio do Inmetro que consta no item 5 deste edital.

7.4 Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos de Metrologia e Qualidade

7.4.1 A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório, com pontuação que varia de zero a 10 (dez), sendo exigida nota mínima 6 (seis) para aprovação. O nome e nota de todos os candidatos serão publicados no sítio do Inmetro, com a indicação daqueles que foram aprovados e reprovados.

7.4.2 A sistemática de realização da prova de conhecimentos específicos consiste em:

a) Que os candidatos tenham acesso a 3 (três) artigos científicos em língua inglesa com diferentes temas em Metrologia e Qualidade, fornecidos pela Secretaria Acadêmica a partir do momento da sua inscrição;

b) Na aplicação de uma prova contendo no total 5 (cinco) questões discursivas sobre os artigos disponibilizados;

c) Que os candidatos façam uso, no momento da prova, da versão impressa dos artigos desde que não haja nenhuma anotação, alteração ou rasura feita pelo candidato. O Programa de Pós-Graduação do Inmetro não fornecerá versões impressas do artigo para consulta durante a prova escrita;

d) Que os candidatos façam uso de dicionário impresso inglês-inglês sem rasuras, anotações ou alterações;

e) A proibição do uso de tradutores ou outros dispositivos de tecnologia eletrônica e de outro material impresso, além do permitido, sob pena de desclassificação do candidato.

7.4.3 A Secretaria Acadêmica enviará os 3 (três) artigos científicos aos candidatos por meio de correio eletrônico (e-mail), após a sua inscrição. Os artigos científicos poderão ser gravados em CD, DVD ou pen drive pela Secretaria, a pedido do candidato, desde que o candidato forneça a mídia a ser utilizada.

7.4.4 Na avaliação da prova escrita, a Comissão Permanente de Seleção observará:

a) Conhecimento teórico e capacidade de análise de resultados científicos;

b) Capacidade de contextualização teórica e metodológica;

c) Capacidade de expressão escrita, incluindo ordenamento lógico dos argumentos, coesão argumentativa, precisão conceitual e gramatical e clareza.

7.4.5 A prova será realizada no Inmetro, Campus Xerém, para os candidatos residentes no estado do Rio de Janeiro. Para os demais candidatos, a prova será realizada nas instalações das Superintendências ou dos órgãos delegados do Inmetro. Todas as provas serão realizadas na data indicada no Calendário de Atividades, apresentado no ANEXO III deste edital.

7.4.6 Os locais de prova serão informados pela Secretaria Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade aos candidatos por meio de correio eletrônico (e-mail).

7.4.7 O número de candidatos selecionados para a Terceira Etapa não poderá exceder o total de 40 (quarenta), respeitada a ordem de classificação obtida.

7.5 Terceira Etapa: Arguição do Candidato

7.5.1 Os candidatos aprovados na Segunda Etapa do processo seletivo participarão da Terceira Etapa, que será composta pela Arguição do Candidato.

7.5.2 A Arguição do Candidato receberá pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), com exigência de nota mínima 6 (seis) para aprovação.

7.5.3 A atribuição de pontuação relativa à arguição considerará sua capacidade de expressão na apresentação de sua experiência profissional e acadêmica, bem como avaliará a motivação e empenho do candidato em cursar o Mestrado, especialmente se suas intenções estão alinhadas com o objetivo do Programa; a disponibilidade do candidato para se dedicar às atividades acadêmicas e de desenvolvimento da dissertação; se os objetivos do candidato estão relacionados com as linhas de pesquisa do programa; bem como sua clareza na exposição de ideias, postura e comunicação verbal apropriadas.

7.5.4 A Arguição do Candidato será individual, agendada pela Secretaria Acadêmica por meio de envio de correspondência eletrônica (e-mail). Os candidatos realizarão suas apresentações no Campus de Inovação e Metrologia. Os candidatos residentes a uma distância superior a 200 km do Campus de

Inovação e Metrologia poderão ser arguidos por videoconferência, respeitando agendamento prévio da Secretaria.

7.5.5 Cada candidato terá o tempo de até 5 (cinco) minutos para fazer a apresentação de sua experiência profissional e acadêmica, sem o uso de qualquer recurso multimídia.

7.5.6 Banca Examinadora deverá ser composta por no mínimo 2 (dois) docentes do Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade e terá até 20 (vinte) minutos para arguir o candidato.

7.5.7 Ficam impedidos de participar da Banca Examinadora: parentes e parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, bem como cônjuge ou companheiro do candidato.

7.6. Quarta Etapa: Análise Curricular

7.6.1 A Quarta etapa é composta de análise curricular dos candidatos classificados na terceira etapa.

7.6.2 A análise curricular será feita com base no Currículo Lattes do candidato e documentos comprobatórios, sendo considerado para análise os últimos 5 anos da produção.

7.6.3 Itens não listados no Curriculum Lattes do candidato ou sem documentos comprobatórios não serão considerados na avaliação.

7.6.4 A análise curricular atribuirá pontuação conforme a tabela constante no ANEXO IV.

7.6.5 A análise curricular atribuirá pontuação máxima de 5 (cinco) pontos.

7.6.6 A Quarta Etapa tem caráter classificatório.

7.7 Classificação

7.7.1 Serão classificados os candidatos aprovados, conforme a soma das pontuações obtidas na Segunda, Terceira e Quarta Etapas do processo seletivo. Em caso de empate será dada preferência àquele que tiver obtido a maior nota na Terceira Etapa do processo. Persistindo o empate, será dada preferência ao candidato de maior idade.

8. DAS BOLSAS DE ESTUDO

8.1 Os candidatos deverão manifestar seu interesse em bolsas de estudo no Formulário de Inscrição.

8.2 As bolsas de estudo do Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Pronametro) poderão ser concedidas em consonância com regras e requisitos do Programa, caso haja disponibilidade orçamentária e financeira.

8.3 As bolsas de estudo serão concedidas aos candidatos aprovados neste Processo Seletivo, de acordo com a ordem de classificação.

8.4 As bolsas de estudo serão concedidas a alunos que se dediquem ao curso em tempo integral e que não possuam vínculo empregatício.

9. DA MATRÍCULA

9.1 Os candidatos classificados que não se matricularem no prazo definido pelo Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade perderão o direito à vaga, sendo convocados novos candidatos entre os aprovados obedecendo à ordem de classificação.

10. DO CALENDÁRIO

10.1 Os candidatos deverão observar as datas e prazos estipulados no Calendário de Atividades constante no ANEXO III, parte integrante deste edital.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 O Curso será realizado nas dependências do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Campus de Inovação e Metrologia, localizado na Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Xerém - Duque de Caxias - RJ.

11.2 O Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade terá a duração de 22 (vinte e dois) meses. As aulas serão ministradas duas vezes por semana, às segundas e terças-feiras, em horário integral.

11.3 Ao aluno que concluir com sucesso o curso será concedido o título de Mestre em Metrologia e Qualidade.

11.4 O curso no Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade é gratuito.

11.5 Todas as etapas do processo seletivo admitem a interposição de recursos dentro do prazo constante no Calendário de Atividades, apresentado no ANEXO III deste edital, exclusivamente através do endereço eletrônico mestradoprofissional@inmetro.gov.br.

11.6 A seleção dos candidatos, realizada por força deste edital, somente terá validade para o presente processo seletivo.

11.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade do Inmetro.

12. DA PUBLICAÇÃO

12.1 Este Edital será publicado no Diário Oficial da União.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR

(Anexos do Edital nº 014 - Seleção Pública)

ANEXO I

MESTRADO PROFISSIONAL EM METROLOGIA E QUALIDADE PROCESSO SELETIVO 2022 DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO	
ITEM	DOCUMENTO
01	Formulário de inscrição
02	Currículo <i>Lattes</i>
03	Carta de Apresentação
04	02 (duas) Cartas de Recomendação
05	Proposta de tema de pesquisa (opcional)
06	Formulário de Termo de Compromisso do Empregador
07	Carta do professor credenciado
08	Cópia legível do Histórico Escolar

ANEXO II - Formulário de Proposta de Tema de Pesquisa (Opcional)

Nome do candidato: _____

Tema proposto pelo candidato (opcional)
Resumo descritivo do tema proposto (até 300 palavras)

Obs.: O resumo descritivo deve conter, de forma sucinta, a motivação e o objetivo do tema proposto.

ANEXO III - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Etapas	Períodos
Inscrição	13/10 a 17/11/2021
1ª Etapa	1ª Etapa
Resultado da análise da documentação	24/11/2021
Recurso	25/11/2021
Resultado do Recurso	29/11/2021
2ª Etapa	2ª Etapa
Prova de Conhecimentos Específicos	01/12/2021 9 h 00 min às 12 h 00 min
Resultado	06/12/2021
Recurso	07/12/2021
Resultado do Recurso	09/12/2021

3ª Etapa	3ª Etapa
Arguição do candidato	13 a 17/12/2021 (conforme agendamento prévio da secretaria)
Resultado	20/12/2021
Recurso	21/12/2021
Resultado do Recurso	23/12/2021
4ª Etapa	4ª Etapa
Resultado	10/01/2022
Recurso	11/01/2022
Resultado do Recurso	14/01/2022
Resultado Final	14/01/2022
Período de Matrícula	A definir
Homologação da Matrícula	A definir
Aula Inaugural	A definir

ANEXO IV - Tabela 1. Pontuação a ser atribuída durante a etapa de análise curricular dos candidatos.

Itens a serem pontuados	Pontuação
Formação Acadêmica	máximo 0,60 ponto
Pós-graduação Lato Sensu	0,20 ponto
Pós-graduação Stricto Sensu	0,40 ponto
Iniciação Científica[1]	máximo 0,40 ponto
Projeto nas grandes áreas de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias	0,05 ponto
Projeto em outra área de conhecimento	0,03 ponto
Produção Acadêmica[2]	máximo 2,0 pontos
Periódico com Qualis Engenharias III A1 (Qualis 2013-2016)	1,00 ponto
Periódico com Qualis Engenharias III A2 ou B1 (Qualis 2013-2016)	0,80 ponto
Periódico com Qualis Engenharias III B2 ou B3 (Qualis 2013-2016)	0,60 ponto
Periódico com Qualis Engenharias III B4 ou B5 (Qualis 2013-2016)	0,40 ponto
Anais de Congressos em qualquer área do conhecimento	0,10 ponto
Demais periódicos sem Qualis Engenharias III e indexados pelas bases ISI Web of Knowledge ou Scopus	0,50 ponto
Experiência Profissional	máximo 1,0 ponto
Experiência profissional relacionada ao tema de primeira escolha (contrato de trabalho, empresa pública ou privada, bolsa de pesquisa, profissional liberal com atividade no CNAE)[3]	0,10 ponto
Vínculo societário ou profissional com empresa de tecnologia ou integrantes <i>destartups</i>	0,10 ponto
Disciplinas Isoladas do Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade / Cursos de curta duração em Metrologia ou Qualidade	máximo 1,0 ponto
Disciplina regular concluída com nota maior ou igual a 8,0 (a cada 15 h de carga horária didática)	0,05 ponto
Curso nas áreas de Metrologia ou Qualidade com duração mínima de 15 horas	0,05 ponto

[1] Por ciclo completo de seis meses.

[2] Por artigo completo publicado ou aceito para publicação.

[3] Por ciclo completo de 1 ano.

ANEXO V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Sistema de Internacional de Medição, Vocabulário Internacional de Metrologia, Incerteza de Medição, Validação de Métodos de Medição, Materiais de Referência, Metrologia Legal, Tecnologia Industrial Básica, Avaliação da Conformidade, Acreditação.

BIBLIOGRAFIA

COSTA-FÉLIX, R.P.B.; BERNARDES, A T (Org.). Metrologia Vol. 1: Fundamentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2017. v. 1. 320 p.

Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2018-2022. Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2017. 71 p.

INMETRO. Vocabulário internacional de termos de metrologia legal. 4. ed. Rio de Janeiro, INMETRO, 2005. 22p.

Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2012. 94 p.

Nota: Complementarmente a bibliografia mencionada, 3 (três) artigos científicos serão enviados aos candidatos por meio de correio eletrônico (e-mail), após a sua inscrição.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.